

第81回応用物理学会秋季学術講演会 ブルカージャパン オンラインセミナー

日時 9月8日(火) 13:15 ~ 13:45

演目

- 原子間力顕微鏡AFMを用いた
半導体・誘電体の最新評価解析技術のご紹介
- 革新的 X 線回折計が切り拓く

最先端薄膜材料分析の新世界



ブルカージャパン株式会社

X線計測事業部

〒221-0022神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9

☎ 045-453-1960 ✉ Info.BAXS.JP@bruker.com

ナノ表面計測事業部

〒104-0033東京都中央区新川1-4-1

☎ 03-3523-6361 ✉ Info-nano.BNS.JP@bruker.com

ブルカージャパン ウェビナー・製品情報 >>>

X線回折装置 ▶ <https://bit.ly/3jvKqta>

原子間力顕微鏡 ▶ <https://www.bruker-nano.jp/webinar#ttl-recording>